



动态二次离子质谱仪

PHI ADEPT-1010™

Automated Depth Profiling Tool



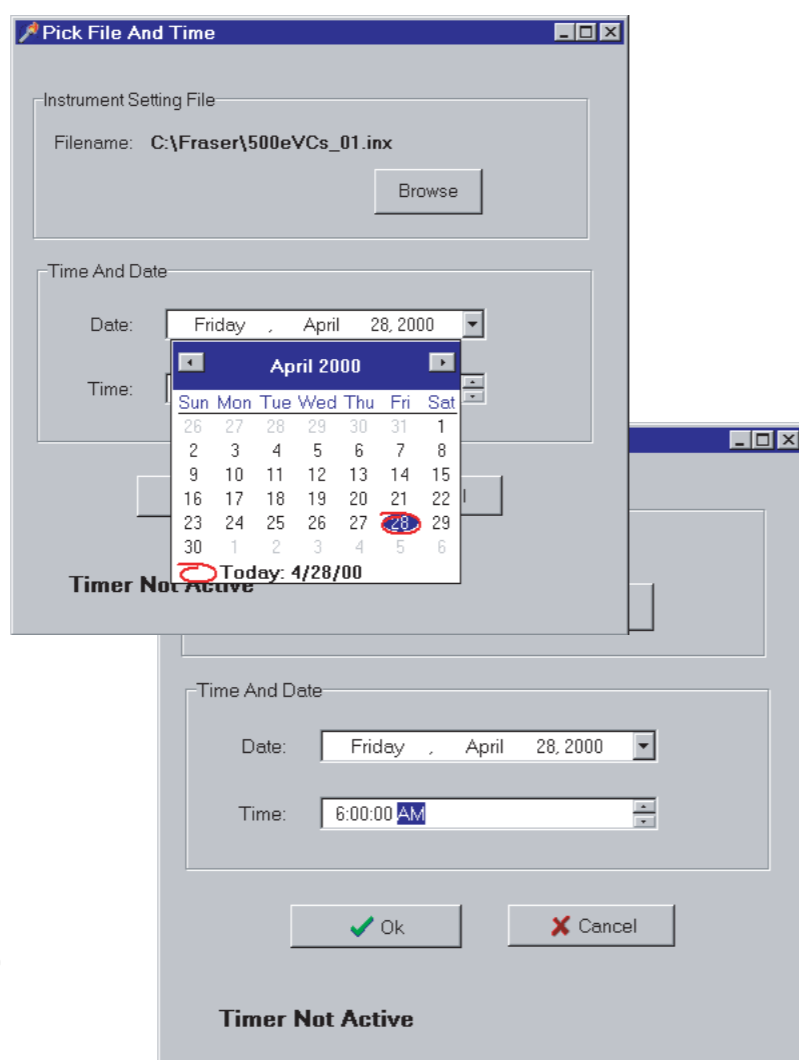
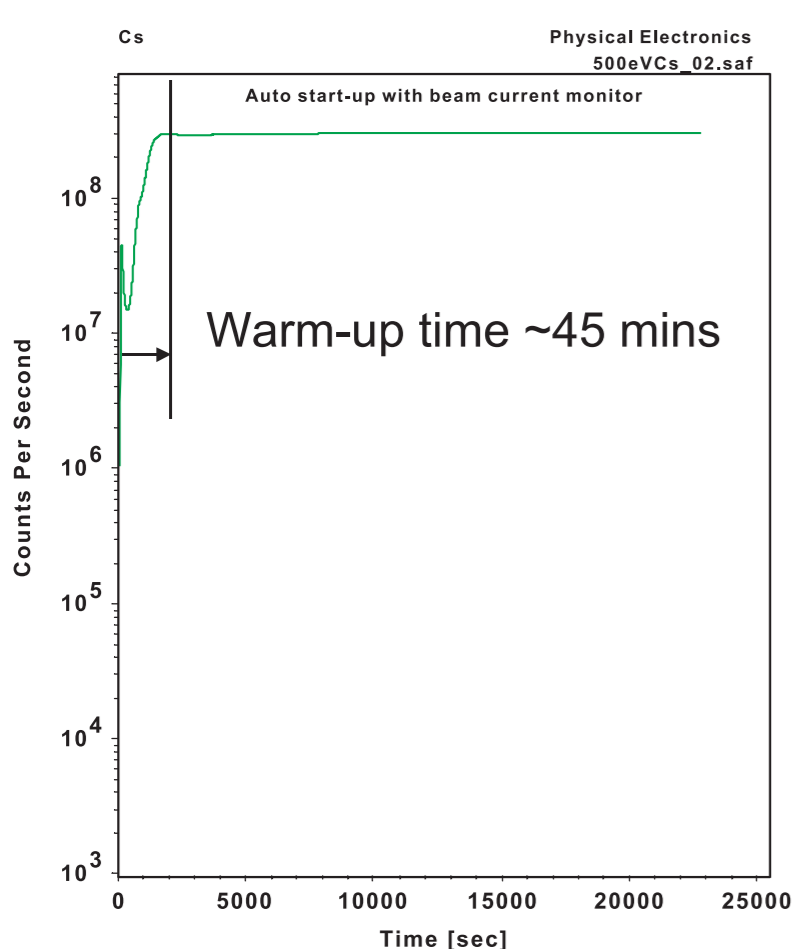
■ 特 长

- 采用~100eV/Oxygen atom的一次离子束可获得极佳的深度分辨率
- 高流通率的二次离子光学系统使得二次离子质谱的动态测定范围以及检测灵敏度得到大幅度改善
- 垂直入射及斜入射（同时吹氧）都可实现高灵敏度的测定
- 5维全自动分析台能进行任意设定的自动分析

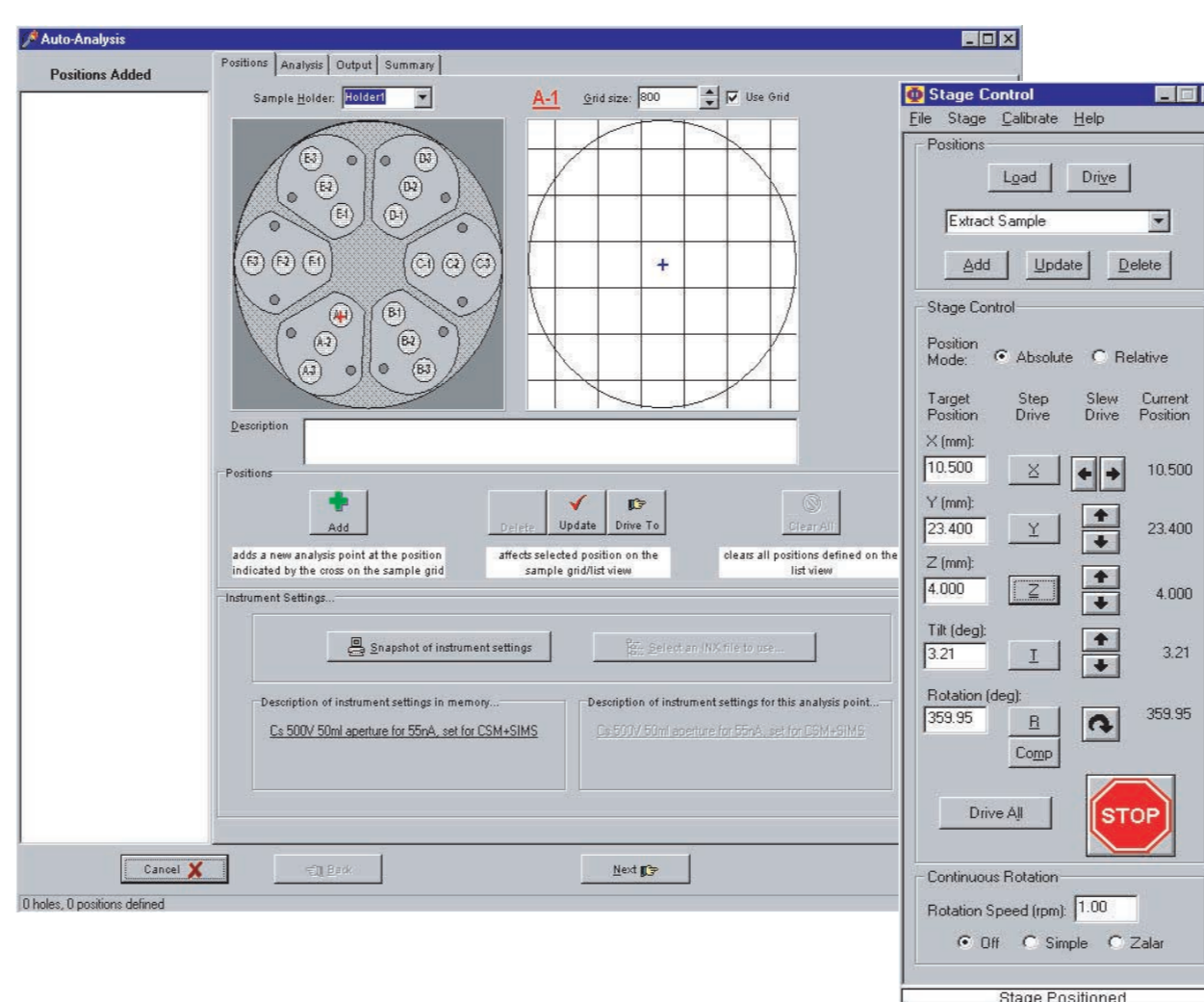
自 动 分 析

■ 自动分析工具

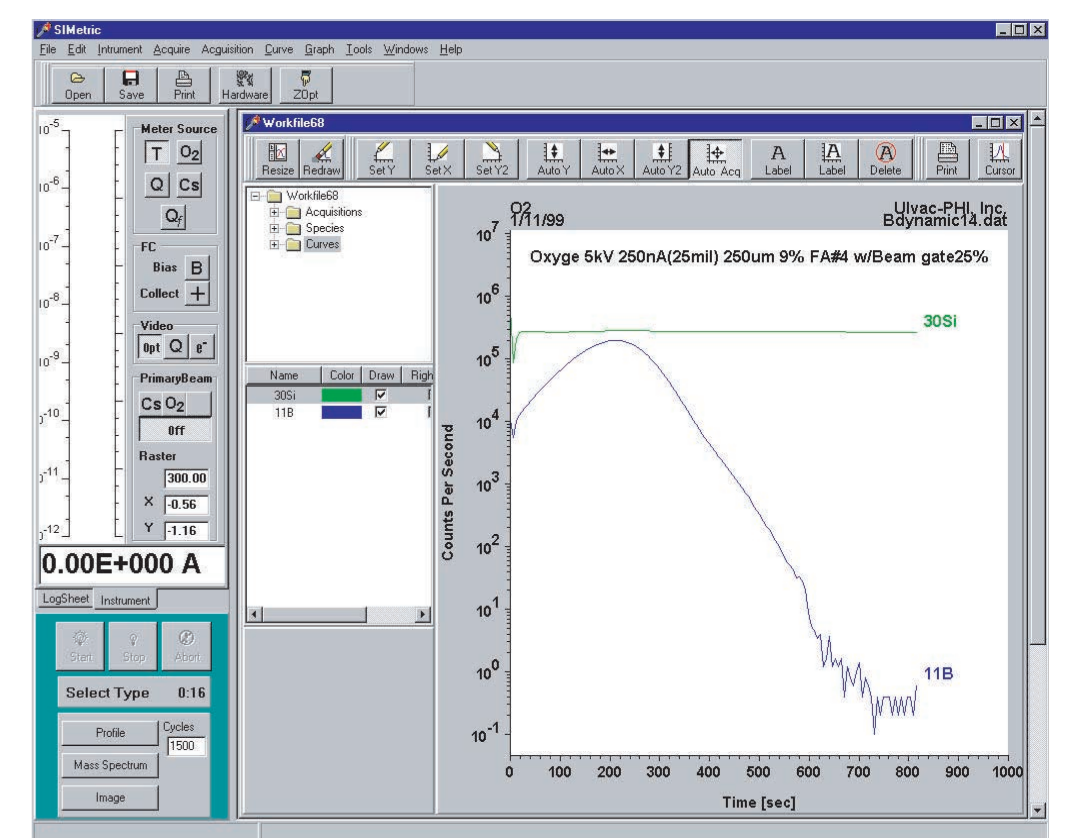
Auto Gun Start-up



■ 自动分析菜单

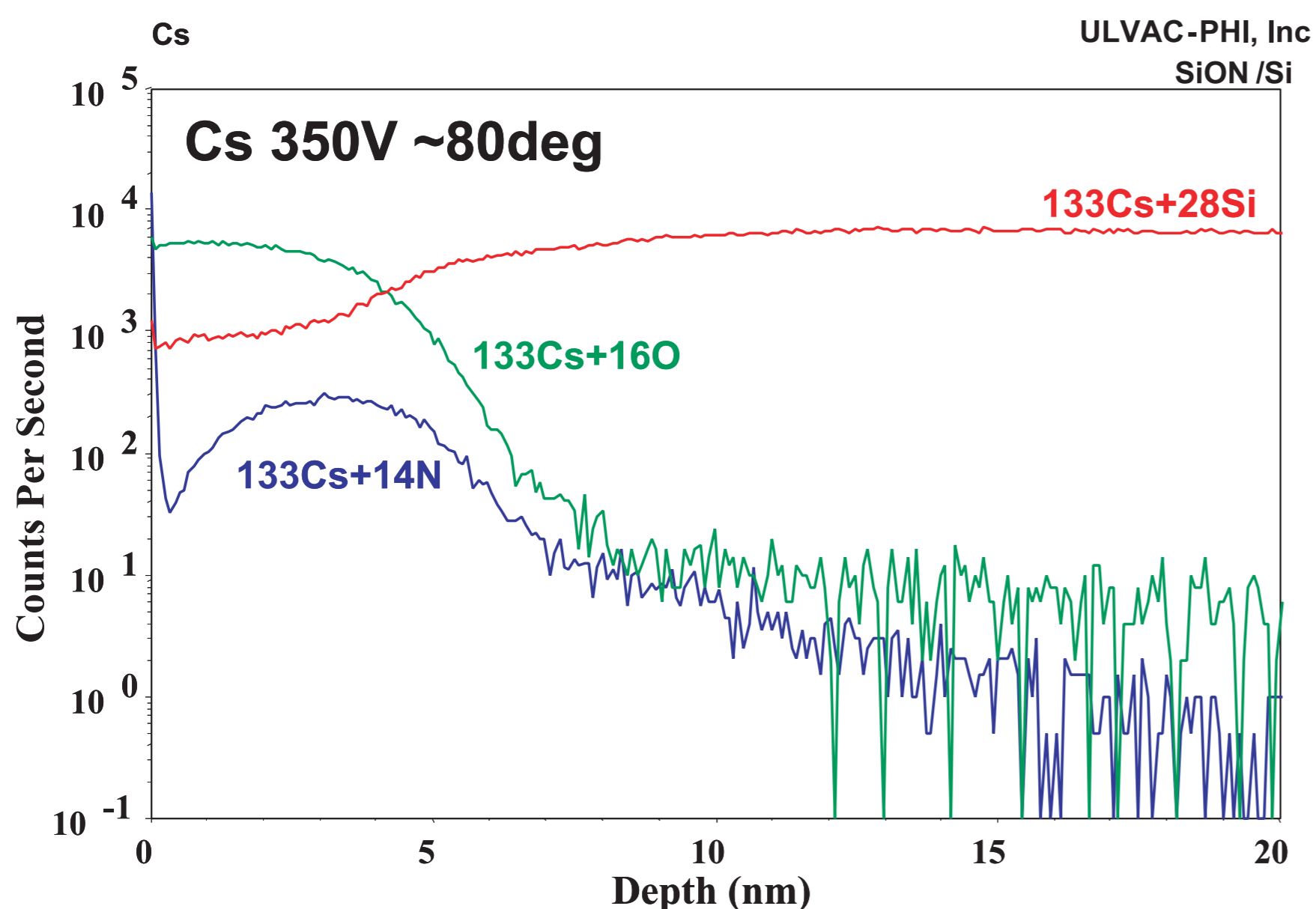


■ SIMetric 软件

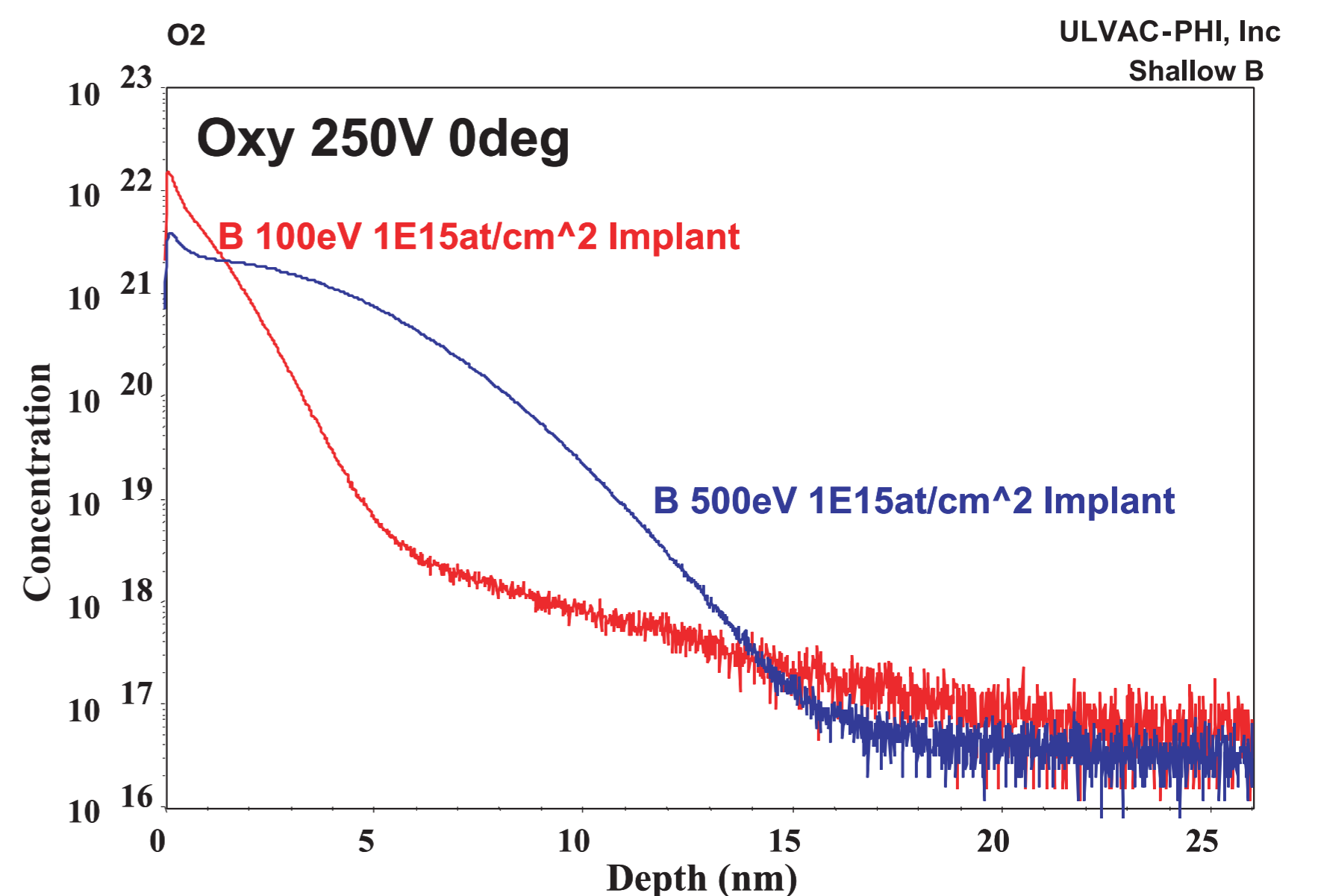


极薄层的深度剖面分析

● SiON膜(3.2nm)深度剖面分析



● Si基板上极浅注入硼的深度剖面分析



纳米级绝缘膜及纳米级注入层的高分辨率高灵敏度的深度剖面分析